X線光学素子用ダイヤモンド 結晶の現状と展望

玉作 賢治 理研播磨

ERLサイエンスワークショップ @KEK 7/10/2009

X線ビームラインでのダイヤモンド利用@SPring-8

XBPM(ビーム位置モニタ): CVD

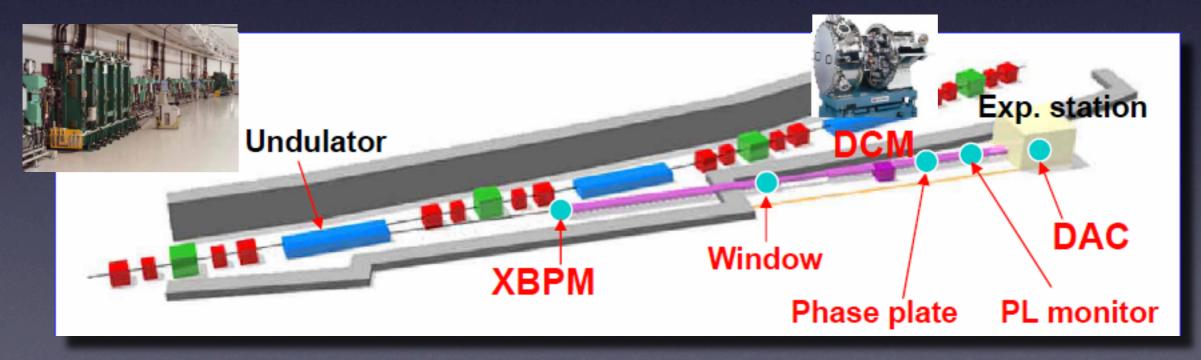
窓材(R&D): CVD

分光結晶: HPHT type IIa

移相子: HPHT type lla

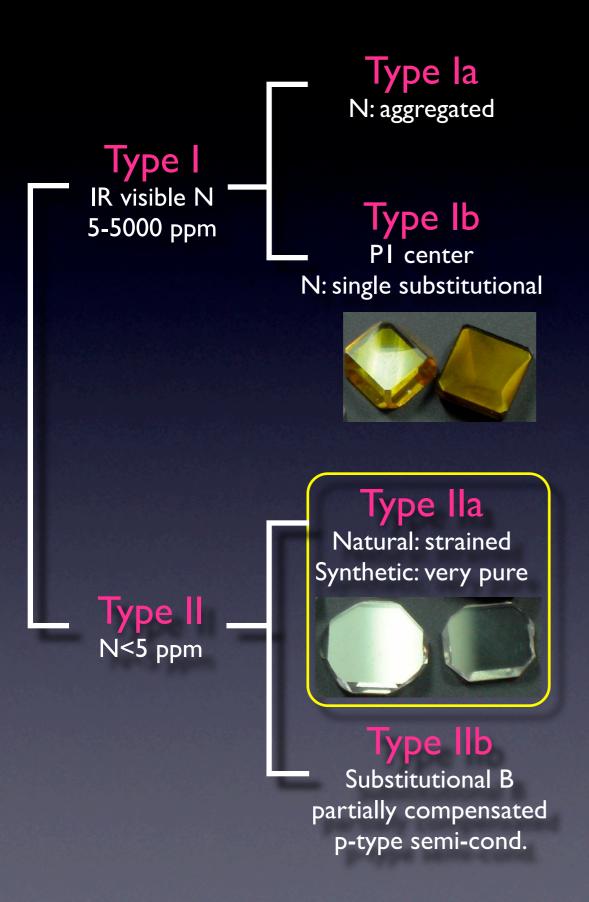
ビームモニター(R&D): CVD

高圧アンビルセル: HPHT type lla



Courtesy of S. Goto (JASRI)

Diamond for x-ray optical elements



高熱負荷分光結晶として

	Diamond	Silicon
Atomic number Z	6	14
Debye Temp. (K)	1860	532
Absorption coef. @ 8 keV (cm ⁻¹)	14	143
Themal conductivity @ 297 K (W/cmK)	Type I: 5-18 Type IIa: 20-25 Iso-pure: 35	1.5
Themal conductivity @ 80 K (W/cmK)	la: 20-40 Ila: 150 Iso-pure: 2000	Nat.: 15 Iso-pure 20
Thermal expansion coef. @ 297 K (10 ⁻⁶ /K)	T ₁	2.4
Figure of merit @ 297 K	36-180	0.44

HPHT合成: High Pressure (~5.5 GPa)

High Temperature (1350 °C)

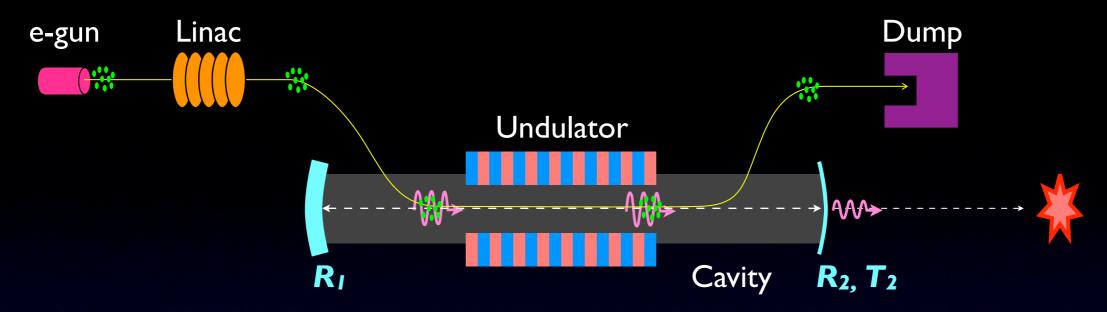
内容

I. XFELオシレータの共振器ミラー

- 2. 非線形結晶としてのダイヤモンド
- 3. ダイヤモンドの結晶評価
- 4. 表面処理の問題
- 5. コヒーレントビームでの問題点

XFEL Oscillator

K. J. Kim et al., PRL<u>100</u>, 244802 (2008).



- お供え
- •Ultra-low emittance @ multi-GeV
- Low-loss x-ray cavity



御利益

- **★**Fully coherent x-rays
- **★**10⁹ photons/pulse
- ★I MHz
- $★\Delta E \sim meV$
- $★\Delta t \sim ps$

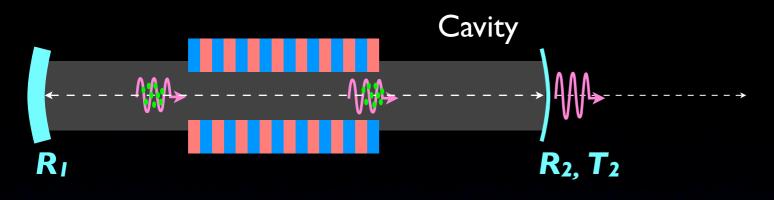
単位バンド幅当たりの

ピーク輝度はXFELと同等

平均輝度はXFELより数桁上

Low-loss x-ray cavity

K. J. Kim et al., PRL<u>100</u>, 244802 (2008).

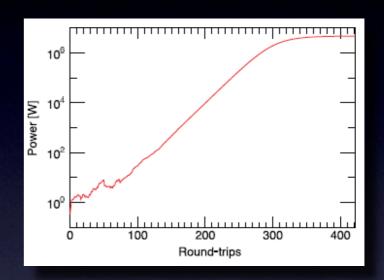


鏡:X線領域ではBragg角90°の 背面反射を用いる。

増幅されるための条件:

$$(I+G)R_1R_2>I$$





 $R_1R_2 > 0.9$

極めて高い反射率が必要

共振器からの取り出し:

 $T_2 \sim 0.05$

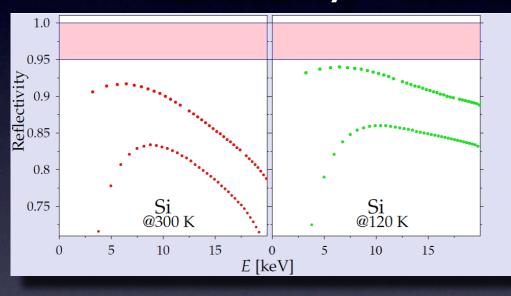
薄い結晶が必要

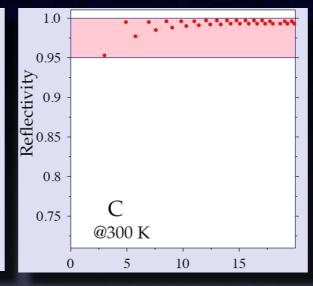
X線は完全にコヒーレント:完全結晶が必要

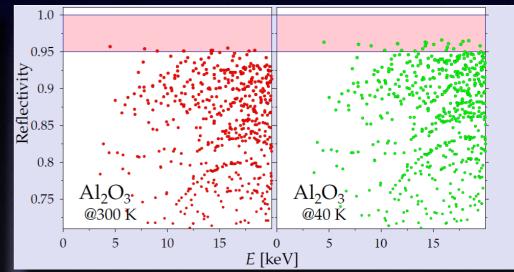
Bragg reflecting mirror

	Reflectivity (>0.95)	Crystal perfection
Si	X	
Diamond		
Sapphire (Al ₂ O ₃)		

Reflectivity - courtesy of Yuri Shvyd'ko (APS)

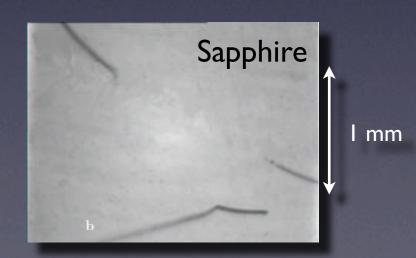






X-ray topography

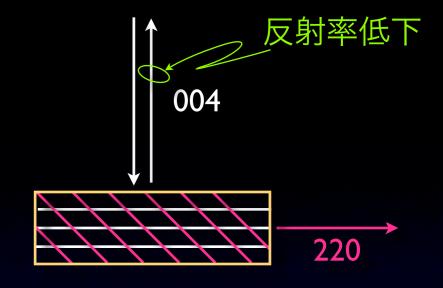




W. M. Chen et al. Phys. Stat. Sol. (a) 186, 365 (2001).

同時反射の問題

対称性の高い<u>ダイヤモンド</u>では、 背面反射に同時反射が付随する。



hkl	同時反射の数	E (keV)
	0	3.01
0 2 2	0	4.92
2 2 4	2	8.5 l
0 2 6	2	10.99
466	2	16.30
0614	2	26.47
113	4	5.76
0 0 4	4	6.95
I 3 3	4	7.58
2 2 4	4	8.5 I

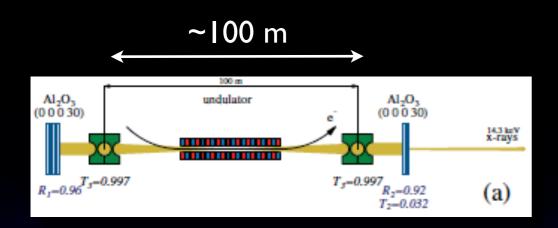


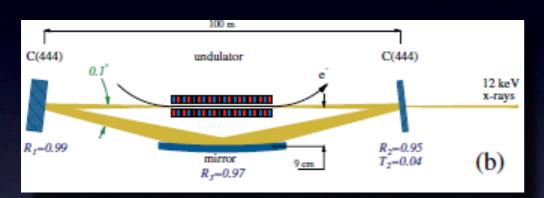
2枚の背面反射で 共振器を組めるのは IIIと022の2つだけ。



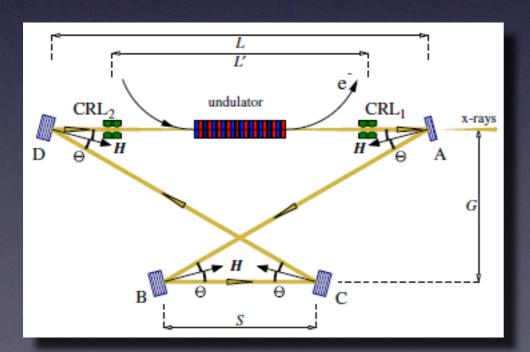
エネルギーが固定され分光学に使えない。

共振器の具体的な配置





K. J. Kim et al., PRL100, 244802 (2008).



<u>サファイア</u>を使った共振器

- ◎広いエネルギー範囲をカバー
- ×結晶性
- ×反射率

<u>ダイヤモンド</u>とミラーを使った共振器

- ×離散的なエネルギーでしか機能しない
- ❷ 結晶性
- ◎ 反射率

4枚の<u>ダイヤモンド</u>を使った共振器

- ◎エネルギー選択の自由度が比較的高い
- ◎ 結晶性
- ☺ 反射率
- × 高い角度安定性(nrad以下)が必要

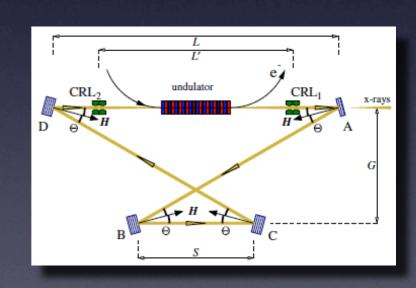
K. J. Kim & Y. Shvyd'ko, PR-ST<u>12</u>, 030703 (2009).

ダイヤモンド結晶としてやること

- 4 mm²程度の領域で完全な結晶
- ●無歪みの表面研磨
- 10-50 μmの薄片化(無歪み)

メカとしてやること

- 着結晶冷却
- 角度の安定化(nrad以下)



内容

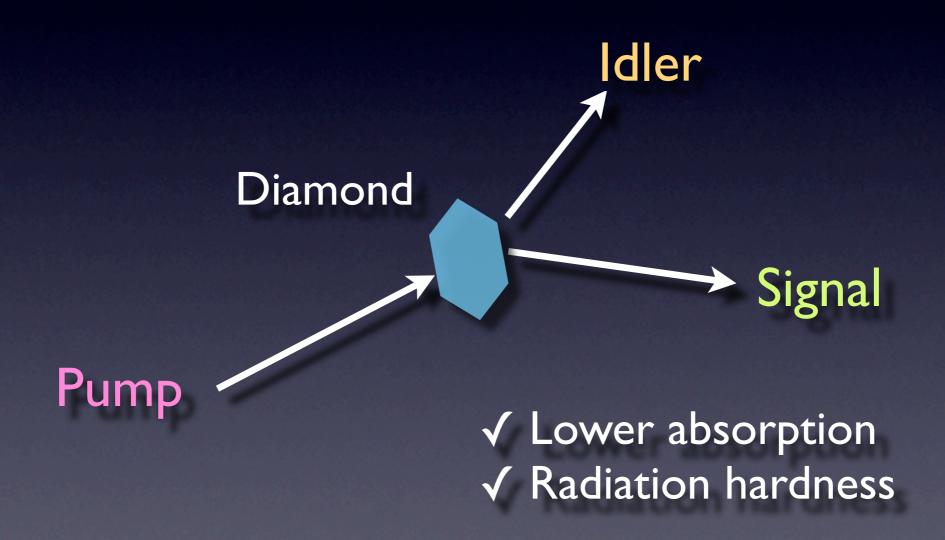
- I. XFELオシレータの共振器ミラー
- 2. 非線形結晶としてのダイヤモンド
- 3. ダイヤモンドの結晶評価
- 4. 表面処理の問題
- 5. コヒーレントビームでの問題点

Diamonds as an x-ray nonlinear crystal

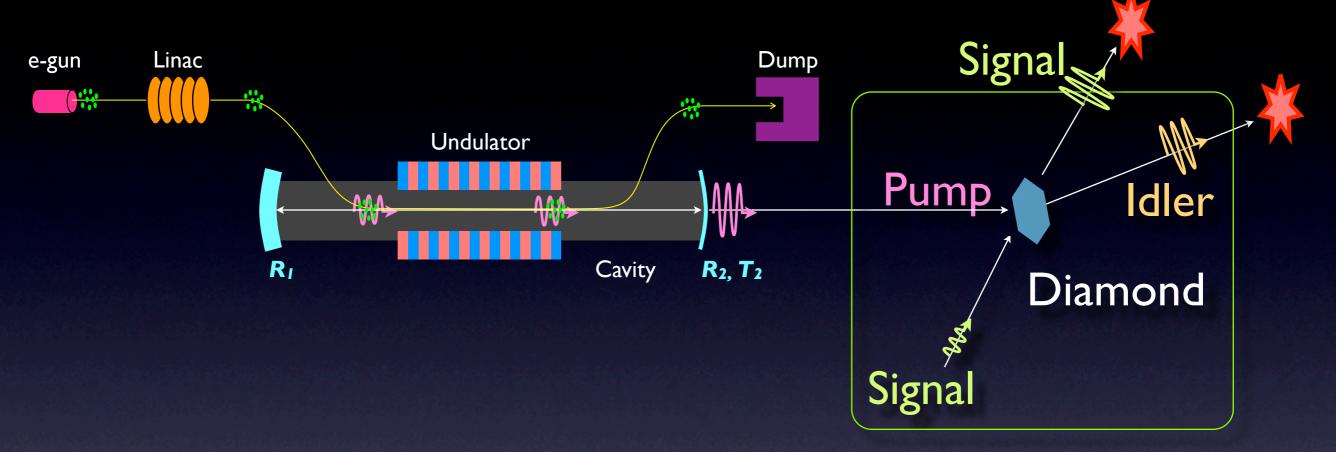
X-ray parametric down-conversion (PDC)

- 2nd order nonlinear process

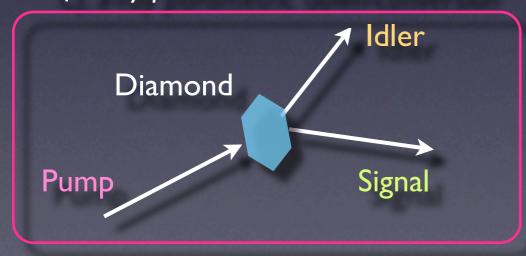
K.Tamasaku & T. Ishikawa, PRL<u>98</u>, 244801 (2007).



XFELO+OPA



Cf. x-ray parametric down-conversion



Optical Parametric Amplifier

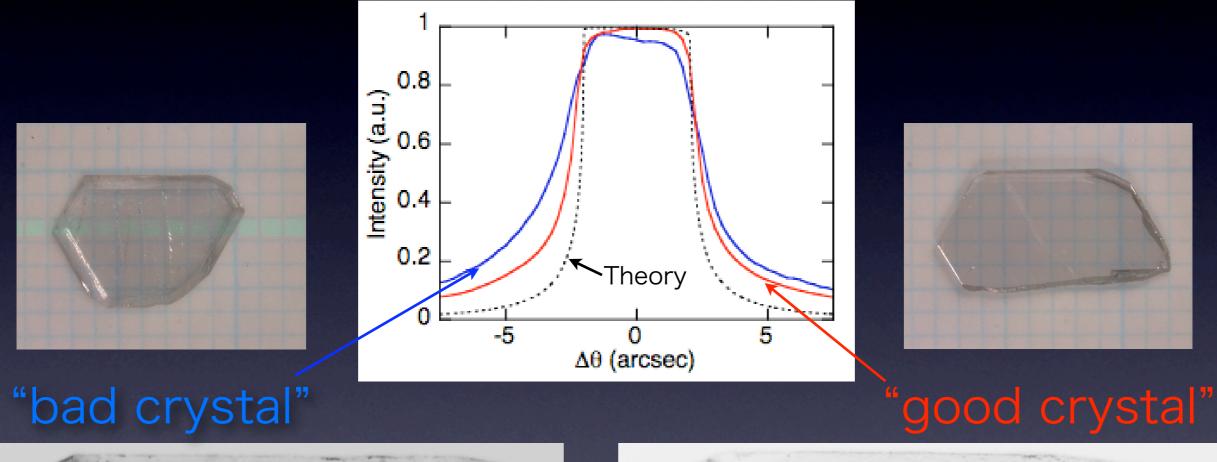
固定波長から任意の 波長に変換可能

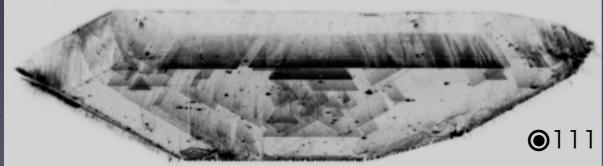
内容

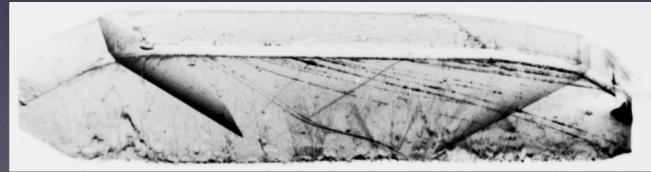
- I. XFELオシレータの共振器ミラー
- 2. 非線形結晶としてのダイヤモンド
- 3. ダイヤモンドの結晶評価
- 4. 表面処理の問題
- 5. コヒーレントビームでの問題点

(111) as-cleaved - Crystal selection

Si220(b=20.9) - C111 @9.44 keV



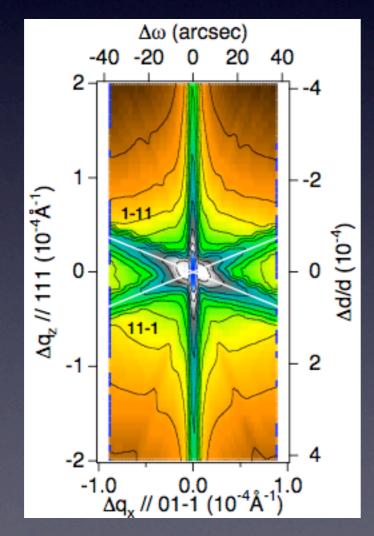




(111) as-cleaved - Reciprocal space mapping

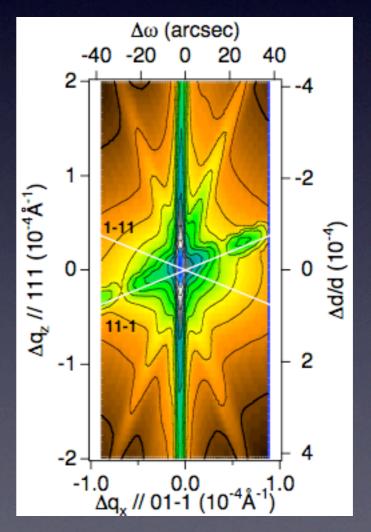
"bad crystal"





"good crystal"





結晶性が良くても表面にダメージがあるとダメ

111 reflection topography on the tail of RC

as-cleaved: highest-quality



polished: many stacking faults



as-cleaved: highest-quality



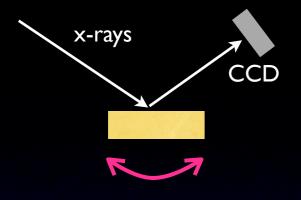
polished: highest-quality, damaged surface



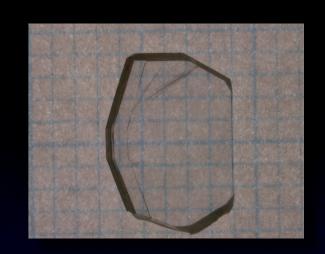
内容

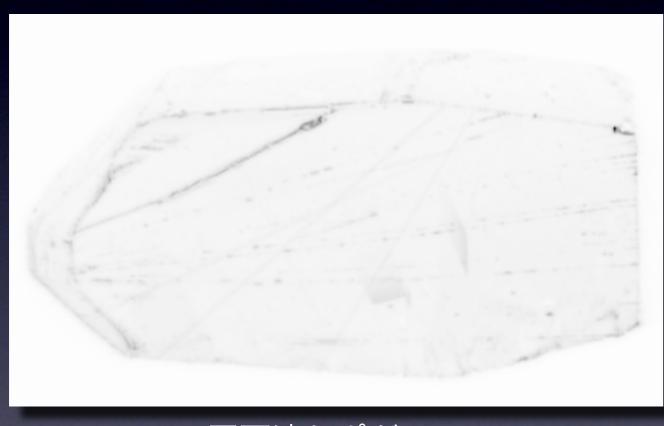
- I. XFELオシレータの共振器ミラー
- 2. 非線形結晶としてのダイヤモンド
- 3. ダイヤモンドの結晶評価
- 4. 表面処理の問題
- 5. コヒーレントビームでの問題点

局所的なロッキングカーブ

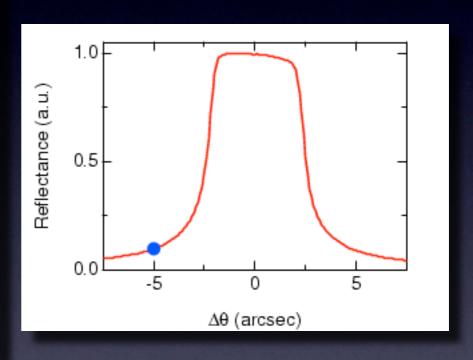


(III) as-cleaved









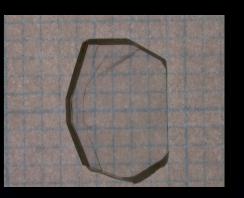
ロッキングカーブ

Si220(b=20.9) - CIII @9.44 keV

ロッキングカーブ(RC)幅・中心の場所依存性

(III) as-cleaved

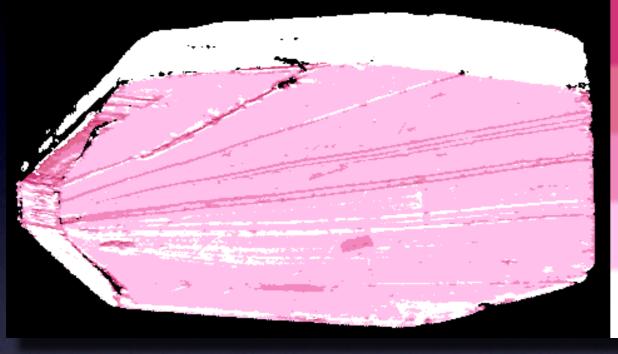
Si220(b=20.9) - CIII @9.44 keV



R.C.Width

map

(Theory 4.4")



>6"

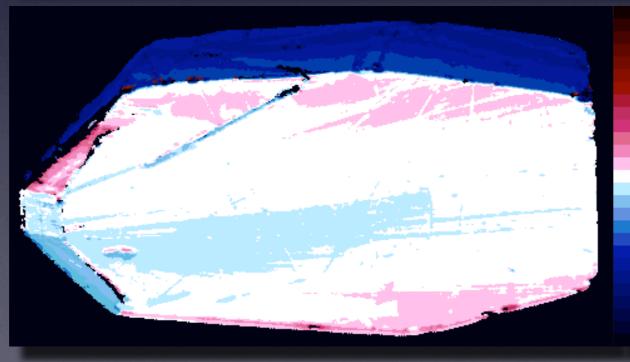
~6.0"

~5.5"

~5.0"

<4.75"

R.C. Center map



0.5" step

表面研磨

Polished (offset 1.5°)

Topography on the tail of RC

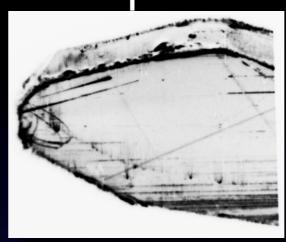
FWHM of RC







Re-re-polished





機械研磨: 成功率が低い上に、ダメージが

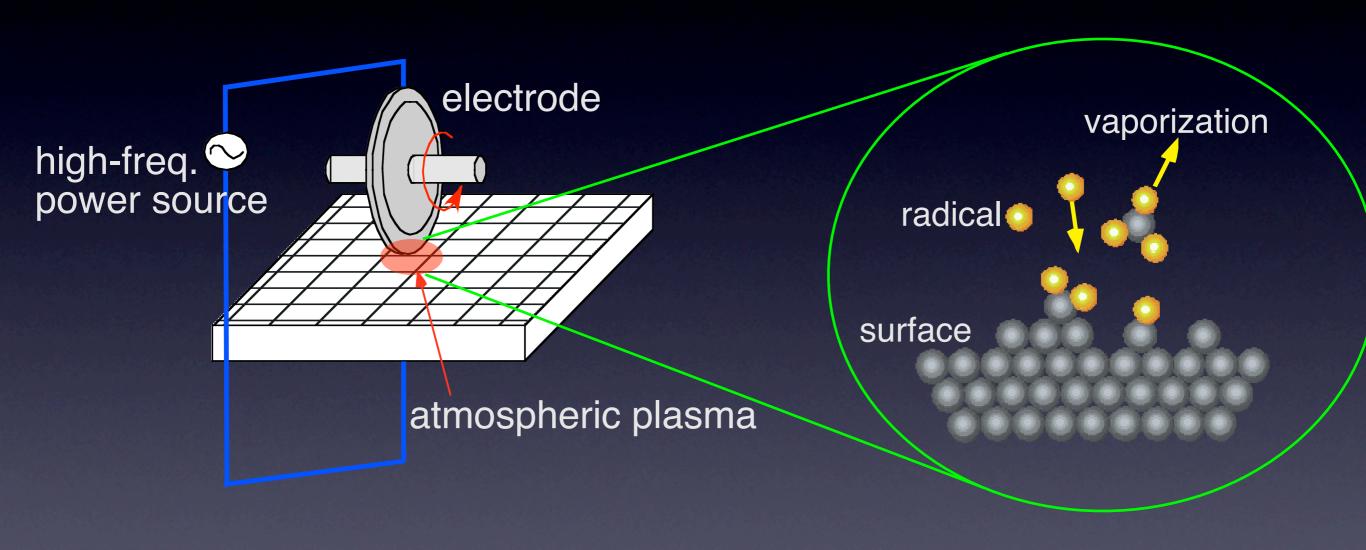
残り完璧な方法とは言えない。

エッチング: KOH+Na₂O₂ @ 700°C

PCVM:新手法

化学的な方法によるダメージ層の除去

PCVM (Plasma Chemical Vaporization Machining) 大阪大学、山内研究室

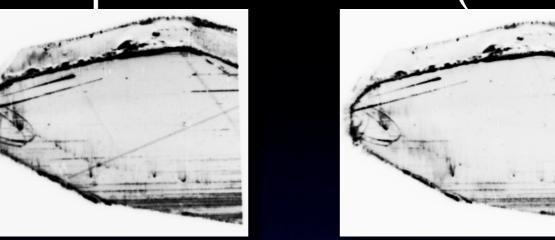


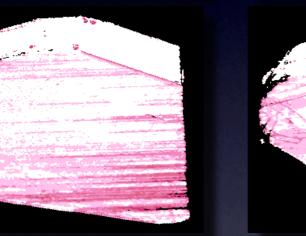
PCVMによる表面処理

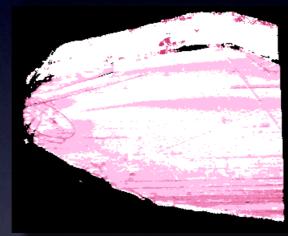
Polished (offset 1.5°)

Re-re-polished





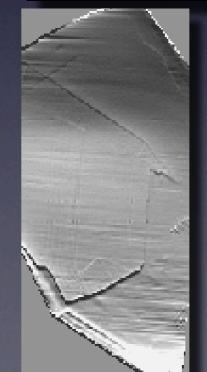






>6" ~6.0" ~5.5" ~5.0" <4.75"





かなり改善するが、 模様が浮き出る!!

Surface profile

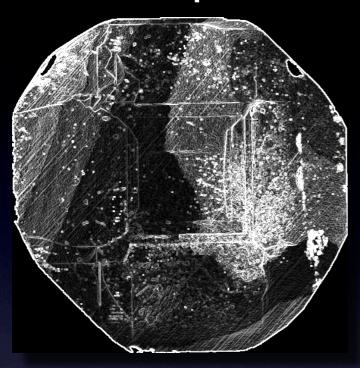
Topograph

FWHM of RC

|]]]

PCVMの問題-(100)面

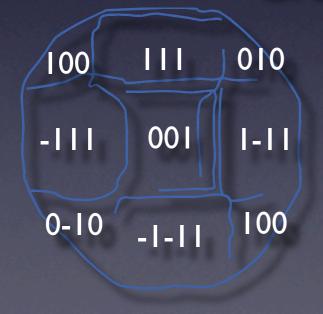
Surface profile

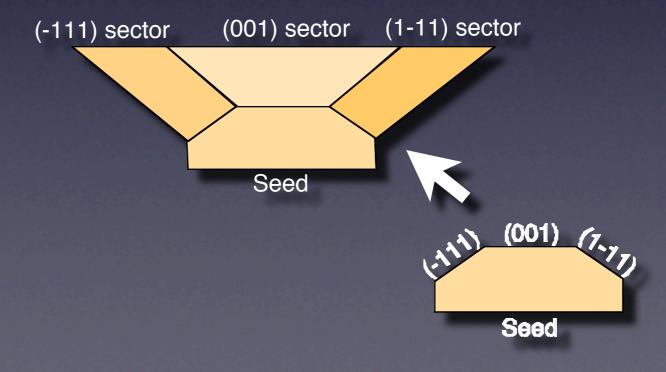


Topograph



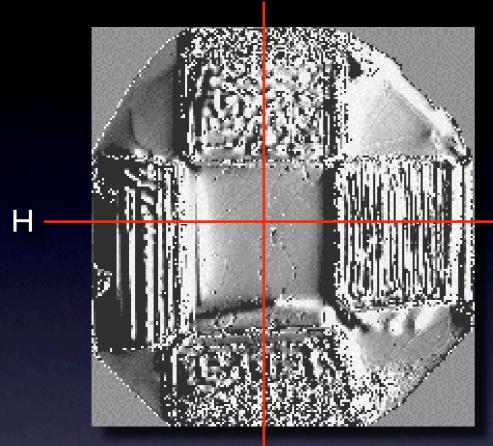
Growth sector

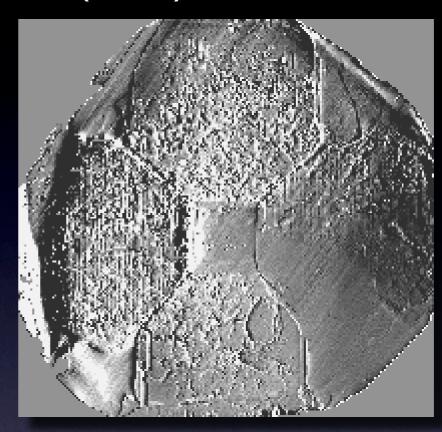


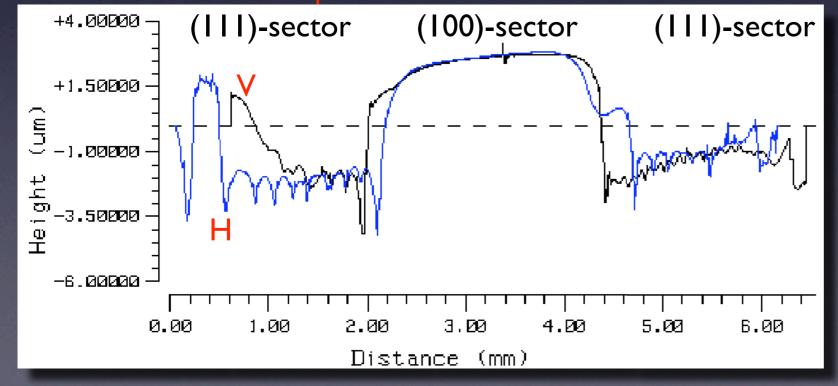


成長分域によるエッチングスピードの違い

PCVM 5 min - (100)







Nitrogen impurity (100)-sector < (111)-sector < 0.1 ppm

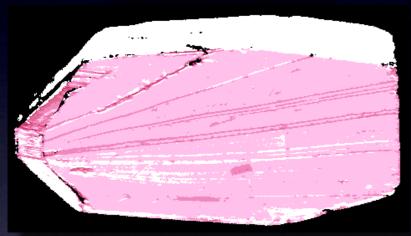
劈開面と研磨面の比較

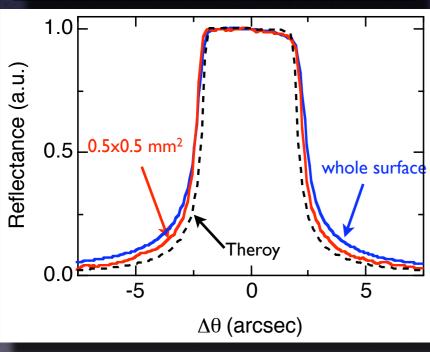
As-cleaved

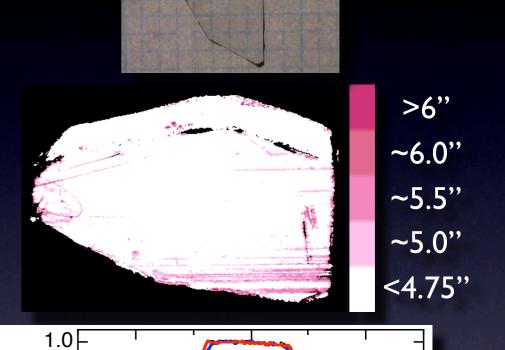
Mechanical polishing+PCVM



成長分域の問題はあるが 研磨+PCVMによって 表面状態は改善する。







Theroy

 $\Delta\theta$ (arcsec)

whole surface

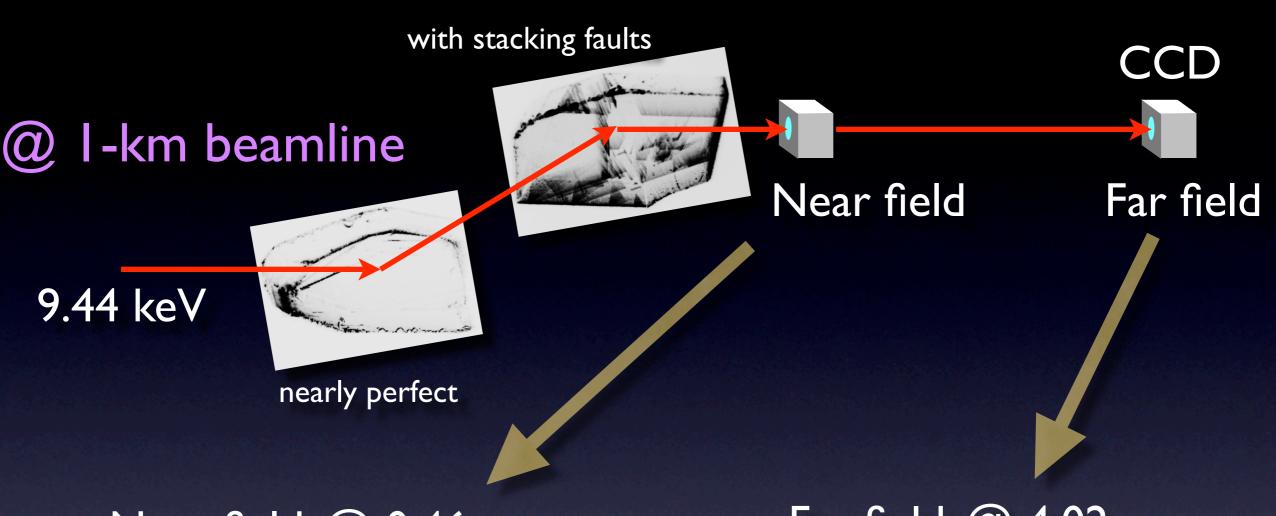
Reflectance (a.u.)

0.5 0.5 mm²

内容

- I. XFELオシレータの共振器ミラー
- 2. 非線形結晶としてのダイヤモンド
- 3. ダイヤモンドの結晶評価
- 4. 表面処理の問題
- 5. コヒーレントビームでの問題点

What happens under coherent illumination?



Near field: @ 0.46 m



uniform

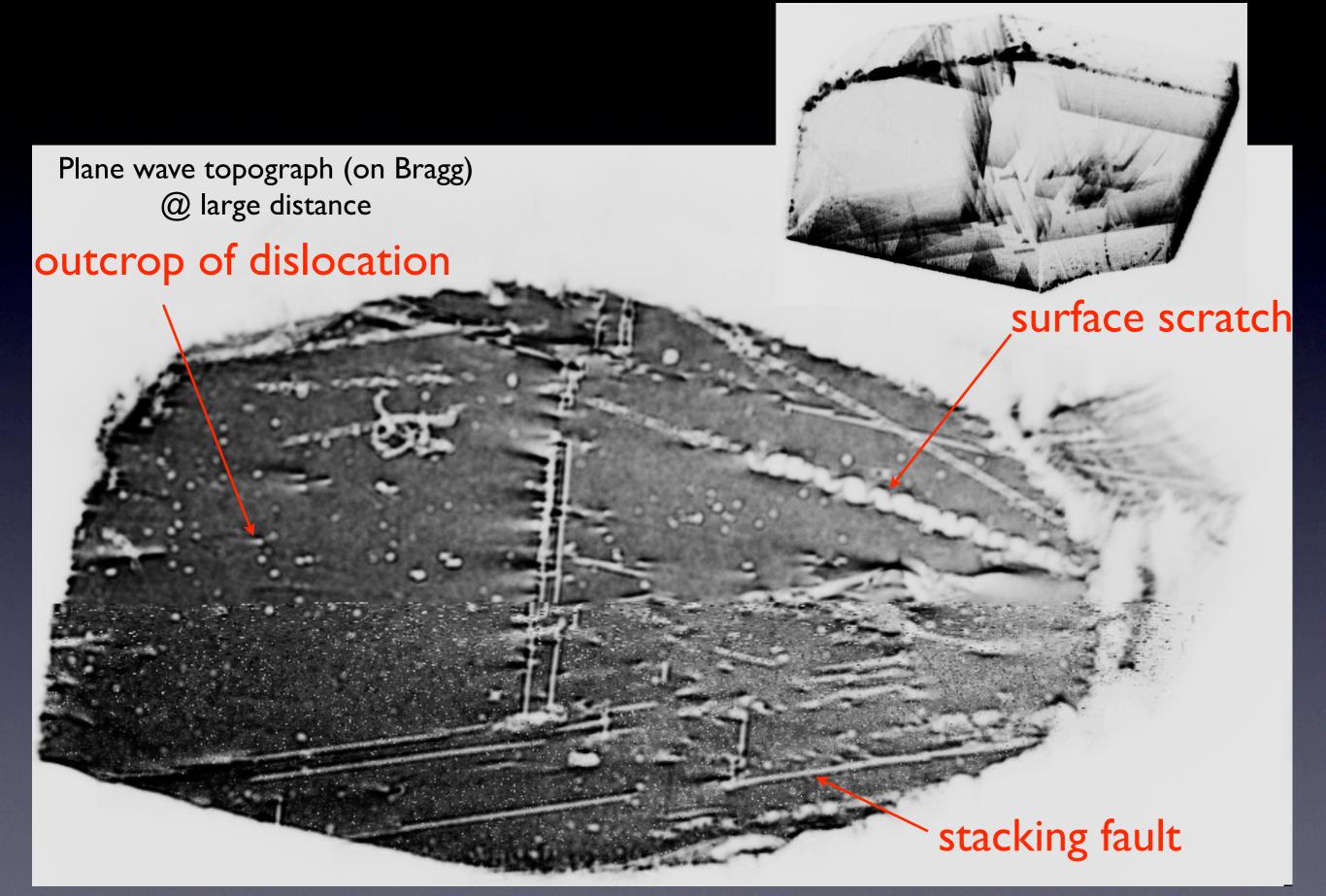
Far field: @ 4.02 m



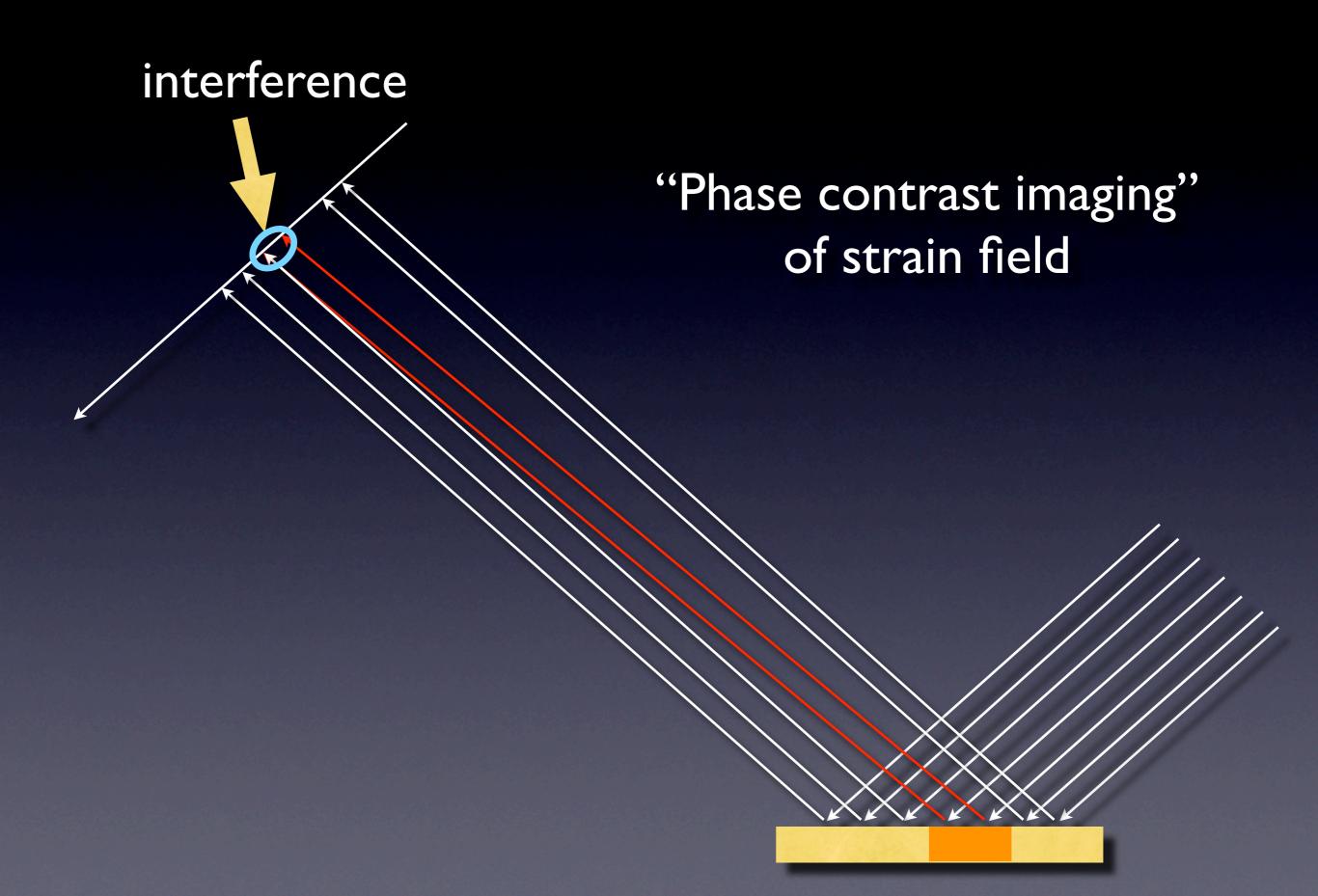
non-uniform

Far field image

Quasi-plane wave topograph (reflection topo on the tail of RC)

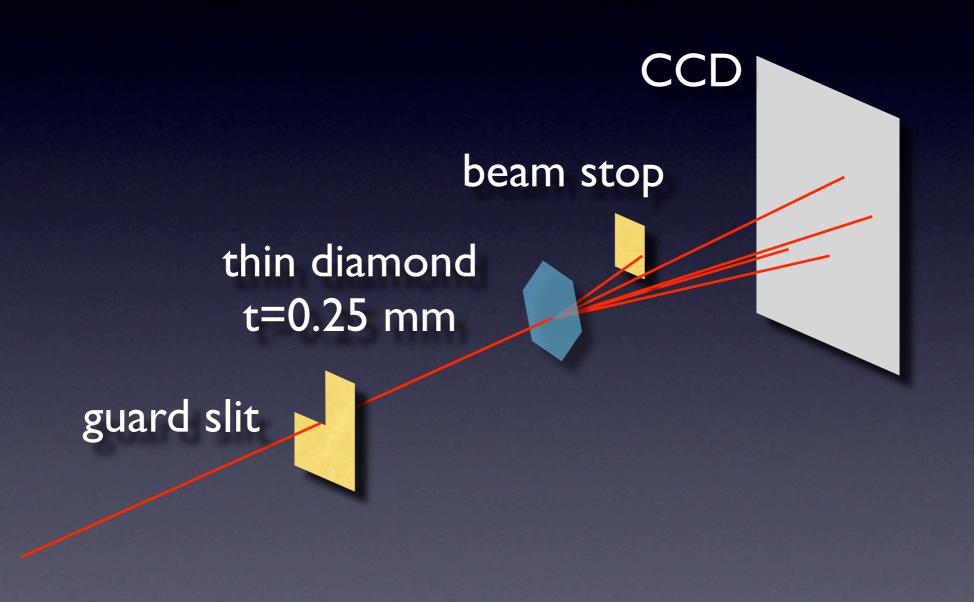


A proposed mechanism



Coherent diffraction imaging of diamond windows

To study what happens under coherent illumination.



Coherent diffraction imaging of diamond windows

due to polishing marks stripe → defects??

direct beam

from guard slit

まとめ

ダイヤモンドは、高熱負荷分光結晶を始めとして、様々なX線光 学素子として利用され始めている。今後XFELOの共振器など更 に進んだ応用が期待される

But,

結晶性:

かなり良くなっている(分光学、回折は**O**K)が、高コヒーレンスのビームを扱うにはまだ不十分(イメージングは×)。

表面:

研磨とPCVMを併用することにより、比較的良い表面が得られるが、更なる改善が望まれる。

薄片化:

今後のR&Dが必要。

共同研究者

結晶評価:

石川哲也(理研)、山崎裕史(JASRI) 鈴木基寛(JASRI)、後藤俊治(JASRI) 角谷均(SEI)

X線非線形光学:

澤田桂(理研)